

Эффекты кристаллического электрического поля в  $\text{Pt}_{0.5}\text{Sr}_{0.5}\text{CoO}_3$

*Е. С. Клементьев, П. А. Алексеев, В. В. Ефимов, И. О. Троянчук, А. С. Иванов,  
В. Н. Лазуков, В. В. Сиколенко*

3

Интерференционное усиление магнитооптического эффекта Керра  
в многослойных структурах в рентгеновском диапазоне длин волн

*Д. А. Татарский, А. А. Фраерман*

10

Динамика перезарядки Al-нанокластеров в матрице GaAs

*Н. В. Востоков, В. М. Данильцев, В. И. Шашкин*

15

Отражательная маска для проекционной литографии на длине волны 13.5 нм

*С. А. Гусев, С. Ю. Зуев, А. Ю. Климов, А. Е. Пестов, В. Н. Полковников, В. В. Рогов,  
Н. Н. Салащенко, Е. В. Скороходов, М. Н. Торопов, Н. И. Чхало*

20

Послойный анализ структур с дельта-слоями методом ВИМС  
с учетом функции разрешения по глубине TOFSIMS-5

*Ю. Н. Дроздов, М. Н. Дроздов, А. В. Новиков, П. А. Юнин, Д. В. Юрасов*

26

Структурно-фазовые превращения при ионной имплантации кислорода в титан

*Д. Б. Богомолов, А. Е. Городецкий, В. Х. Алимов*

31

Структура гетерогенных состояний и магнитные свойства  
в нанокристаллических пленках CoPd

*Е. М. Артемьев, М. Е. Артемьев, Л. Н. Рузанова*

41

Цепочки би-сквидов и параллельных СКИФ-структур для построения  
активных электрически малых антенн

*И. И. Соловьев, В. К. Корнев, А. В. Шарафиев, Н. В. Кленов, О. А. Муханов*

45

Многослойные структуры для спектральной области “водного окна” на основе скандия

*С. С. Андреев, М. М. Барышева, П. К. Гайкович, Д. Е. Парьев, Н. И. Чхало*

52

Особенности формирования рентгеновских изображений  
в двулучепреломляющих кристаллах

*Е. В. Зайцева, А. С. Маркелов, В. Н. Трушин, Е. В. Чупрунов*

55

Сравнительные исследования особенностей формирования  
примесной неоднородности в кристаллах GaSb:Te при направленной кристаллизации  
в космических и наземных условиях

*Ю. А. Серебряков, В. Н. Власов, В. С. Сидоров, И. А. Прохоров,  
И. Л. Шульпина, Е. Н. Коробейникова*

59

Определение параметров структуры низкобарьерного диода с приповерхностным  
дельта-легированием по данным о температурной зависимости ВАХ

*А. В. Мурель, В. И. Шашкин*

68

Оценка предела обнаружения элементов в рентгеноспектральном микроанализе (РСМА)

*И. М. Романенко, А. А. Вирюс (Муханова), В. А. Чурин, А. С. Деянов, А. С. Иванов*

72

Физические свойства кластеров диоксида кремния, покрытых серебром.  
Компьютерный эксперимент

*А. Е. Галашев*

80